自由空間における反射係数を利用した複素比誘電率の測定

林 達郎*1), 髙井 伸一郎*2)

Measurement of Relative Permittivity

using Reflection Coefficient in Free Space

HAYASHI Tatsuro^{*1)}, TAKAI Shinichiro^{*2)}

GHz 帯における材料の複素比誘電率 $\dot{\epsilon}_{\gamma}$ や複素比透磁率 $\dot{\mu}_{\gamma}$ の測定には、試料面における S パラメータを測定 し、ここから計算モデルを用いて算出する方法が用いられている. S パラメータの測定には同軸導波管法や 自由空間法などが用いられるが、同軸導波管法は試料を小型精密加工して治具内に挿入する必要があるため 性質上適さない材料も多い. 一方、自由空間法は作製しやすい大型の平板試料で測定が行えるが、透過係数 が必要となる場合には試料を回り込む電波を遮蔽する環境が必要となり、測定系が大掛かりとなる. 本研究 では自由空間に設置した 1 アンテナによる簡単な測定系で、大型の平板試料の反射係数のみを測定した値か ら材料の $\dot{\epsilon}_{\gamma}$ 算出を試みた. アクリル樹脂とモルタルを対象に測定を行なったところ、狭帯域ながら $\dot{\epsilon}_{\gamma}$ の測定 が行えることを確認した.

1. 緒言

筆者らは土木建築の分野で汎用性が高いモルタルに電波 吸収特性を付与する研究を行っている.電波吸収体の設計 には、材料の定数として複素比誘電率 ε_{γ} や複素比透磁率 μ_{γ} が用いられるが、多くの場合は未知であるため、測定が必 要である.

GHz 帯における材料のέ_vやµ_vの測定には、まず試料面に おける S パラメータ (電波の反射や透過の係数)を測定し、 ここから計算モデルを用いて算出する方法が一般的である. S パラメータの測定には同軸導波管法や自由空間法などが 用いられるが、同軸導波管法は試料を小型精密加工して治 具内に挿入する必要があるため、構造が不均一な材料やモ ルタルのように加工性が低い材料には不向きである.一方、 自由空間法は作製しやすい大型の平板試料で S パラメータ の測定が行えるが、透過係数が必要となる計算モデルを用 いる場合は、測定に際し試料の周囲から回り込む電波を遮 蔽するシールドボックスなどの環境が必要となり、測定系 が大掛かりとなる.

本研究では、できるだけ簡易な測定系で材料の*ɛ*_vを測定 することを目指し、自由空間に設置した1アンテナで大型 の平板試料の反射係数のみを測定した値から*ɛ*_vの算出を試 みた.アクリル樹脂とモルタルなどを対象に測定を行なっ たところ、狭帯域ながら*ɛ*_vの測定が行えることを確認した ので事例を以下に示す.

2. 測定原理

2.1 反射係数から*έ*_νの算出

本研究では TEM モードの同軸導波管で利用される計算 モデルを自由空間に応用した.

同軸導波管などに試料が挿入されたときのSパラメータ から*έ_yやµ*を求める計算モデルは種々¹⁾²⁾提案されている. これらを自由空間に応用することを想定したとき,透過係 数が必要になる場合にはアンテナが2台必要で,さらに試 料周囲からの回り込みを防ぐ環境が必要となる.そこで, アンテナ1台で測定できる反射係数のみを用いて*έ_y*の算出 を行う計算モデルに着目した.



図1 開放端に設置した試料

図1のように厚みdの誘電体試料を同軸導波管の開放端 に設置したとき、左から右方向へ進行する電波の波長 λ に 対して試料の厚みdが十分に薄ければ、試料表面の反射係 数から求まるアドミタンスY は近似的に次のように示され る.

$$\dot{Y}=j\dot{Y}_{0}\dot{\varepsilon}_{\gamma}\frac{2\pi d}{\lambda}=j\dot{Y}_{0}(\varepsilon_{\gamma}{'}-j\varepsilon_{\gamma}{''})\frac{2\pi d}{\lambda}$$

これより、アドミタンス \dot{Y} が求まれば周波数ごとの $\dot{\epsilon}_{\gamma}$ が 算出できる.

2.2 自由空間への応用

2.1 を自由空間に応用するため、図2に示す構造の試料 台を準備した. 試料台の上に短絡端である金属板を設置, ここからアンテナ側に近づき電界最大となる開放端付近に 試料を設置するため、低誘電率の樹脂スペーサーを設置し た. その上に設置する試料単体のアドミタンスYは,試料表 面の反射係数から求まるアドミタンスY2を差分して求めた.





図2 反射係数の測定

3. 実験方法

3.1 測定方法

試料を図2に示す試料台上のスペーサーに重ねて設置し て得られた試料単体のアドミタンスYから*έ*_yを算出した. 測定対象周波数は1~8GHzで,使用したアンテナはダブル リジッドガイドホーンアンテナ Schwarzbeck 製 9120D であ る. なお,試料を開放端付近に設置するためのスペーサー として厚み17mm, 10mm, 5mm の3種類の発泡樹脂を使 用した.

3.2 *έ_v*が既知の材料の測定

測定精度を予め確認するため、 $\dot{\epsilon}_{\gamma}$ の値が既知であるアクリル樹脂の測定を行った.アクリル樹脂の代表的な $|\dot{\epsilon}_{\gamma}|$ を表1に示す.

表 1	アク	IJ	ル樹脂の	比誘電率	3)
-----	----	----	------	------	----

Frecuency	$ \dot{\varepsilon}_{\gamma} $
1kHz	3.5~4.0
1MHz	3.0~3.5
1GHz	2.58

1GHz 以上の実数部の値は周波数分散が少ないものと仮 定し、本研究では表中 1GHz の値 2.58 を 1~8GHz の代表 的な値として代用した.また、通常のアクリル樹脂は絶縁 体であるため、導電性の影響を受ける虚数部は0として取 り扱った.測定に用いた試料の寸法は 300×300mm で、厚 みが 2mm の平板シートである.

3.3 *έ*_νが未知の材料の測定

*έ*γが未知の材料としてモルタルの測定を行った.使用したモルタルはセメントに普通ポルトランドセメントを,また細骨材に 0.6 mm ふるいを通過したものを使用した.モルタルの配合は水セメント比 W/C が 60%,砂セメント比 S/C は 2.56 である. 試料の寸法は 300×300mm で,厚みが2mmの平板形状に作製した.なお,測定に際し試料を一般的な気乾状態に近づけるため,予め室温が約 20℃,湿度 40~50%の環境で 2 週間保管した.

3.4 測定結果の検証

 $\dot{\epsilon}_{\gamma}$ が未知の材料の測定結果の妥当性を検証するため,同 一試料を対象に全く異なる測定法で得られた $\dot{\epsilon}_{\gamma}$ と比較検討 を行った.比較対象とした測定法は2台のアンテナと試料 設置用シールドボックス⁴⁾を用いて測定した試料の透過係 数から,伝送線理論に基づく逆推定問題として近似計算で $\dot{\epsilon}_{\gamma}$ を求めたものである.



4. 結果および考察

4.1 *έ*_νが既知の材料の測定結果

アクリル樹脂を対象にを_vの測定を行なった結果を図4に 示す.1アンテナの簡易な環境で測定した結果は実数部が約2.5で虚数部が0付近を示す平坦部と、スペーサーの厚 みごとに異なる特定周波数帯に急変部がみられる.この急 変部は、既知の代表値との比較で顕著な差として認められることから、今回の測定法に起因する誤差と考えられる.

スペーサーの厚みが 17mm のとき,スペーサーの上面が 開放端になる波長 λ は λ/4=17mm から逆算して 68mm で





ある. このとき周波数は 4.4GHz 付近であるためこれより 波長が長い,即ち低い周波数帯において試料が開放端付近 に位置し,測定精度が得られたと考えられる. 同様にして, スペーサーの厚みが 10mm のときにスペーサー上面が開放 端になる周波数は 7.5GHz 付近,スペーサーの厚みが 5mm のときにスペーサー上面が開放端になる周波数は 15GHz 付近であるため,それぞれそれより低い周波数帯で一定の 測定精度が得られたと考えられる.

一方,周波数が1GHz付近では試料寸法が1波長程度と なることに加え,スペーサーが薄い場合には,短絡端とな る金属板に試料全体が近づくため,測定誤差が急激に増大 したものと推察される.

これより,スペーサーの厚み調整により,試料が開放端



図5 モルタルの測定結果

付近にある場合に $\dot{\epsilon}_{\gamma}$ の測定が可能であることが確認できる.

4.2 *έ*_νが未知の材料の測定結果

モルタルを対象に*έ*_vの測定を行なった結果を図 5 に示 す.1 アンテナの簡易な環境で測定した結果は,実数部が 約7で虚数部が0付近を示す平坦部と,スペーサーの厚み ごとに異なる特定周波数帯に急変部がみられる.この急変 部は,2 アンテナの測定法による結果との比較でも顕著な 差として認められることから,**4.1**と同様に今回の測定法 に起因する誤差と考えられる.

スペーサーが各厚みの際に、少ない誤差で測定が可能と なる周波数帯についても、**4.1**と類似の傾向が得られてお り、気乾状態のモルタルの $\dot{\epsilon}_{\gamma}$ は実数部が約7で、虚数部が ほぼ0であることがわかる.

5. 結言

簡易な測定系で材料の ε_{γ} を測定することを目指し,自由 空間に設置した1アンテナで大型の平板試料の反射係数の みを測定した値から ε_{γ} の算出を試みた.

結果として,試料を開放端となる付近に配置するための スペーサーの調整と組み合わせにより,狭帯域ながら特定 の波数帯においてέ_vの測定が行えることが確認できた.

今後は、試料の厚みがさらに増加した場合に発生する誤差について実験検討を進めるとともに、より大きな*έ*_vをもつ材料への対応や1~8GHzの周波数帯内で顕著な周波数分散特性を示す材料の場合にスペーサーによる誤差との分離可能性について検討を行う必要がある.

この方法を用いれば、モルタルのように薄型に成型が困 難な材料でも、原料をスペーサー上部に塗布することで形 状を保持したままを_yの測定が行える利便性があることから、 引き続き測定精度の向上のため研究を進めたい.

6. 謝辞

本研究の実施にあたり,摂南大学理工学部都市環境工学 科の熊野研究室の皆様にご協力頂きました. なお,本研究で使用したアンテナ及びネットワークアナ ライザは,公益財団法人 JKA の「機械工業振興補助事業」 により導入,設置したものである.

参考文献

- 1)橋本修, "高周波領域における材料定数測定法", pp139-140,森北出版
- 2) 橋本修, "電波吸収体の技術と応用", pp43-51, シーエム シー出版
- 家田正之,成田賢仁,高橋清,柳原光太郎,"電気・電子 材料ハンドブック",pp107,G7-1,朝倉書店
- 4) 林達郎,高井伸一郎,"モルタルの含水条件が電波吸収 特性に与える影響について",G7-1,平成28年電気関係 学会関西連合大会

